

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60556

1982

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-07

Amendement 1

**Méthodes de mesure des propriétés des
matériaux gyromagnétiques destinés aux
applications hyperfréquences**

Amendment 1

**Measuring methods for properties of
gyromagnetic materials intended for
application at microwave frequencies**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 51 de la CEI: Composants magnétiques et ferrites.

Le texte du présent amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
51/461/FDIS	51/484/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.



iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

[IEC 60556-1:1982/AMD1:1997](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/540fed71-f9e0-4b30-8910-94e833815e7e/iec-60556-1982-amd1-1997)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/540fed71-f9e0-4b30-8910-94e833815e7e/iec-60556-1982-amd1-1997>

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 51: Magnetic components and ferrite materials.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
51/461/FDIS	51/484/RVD

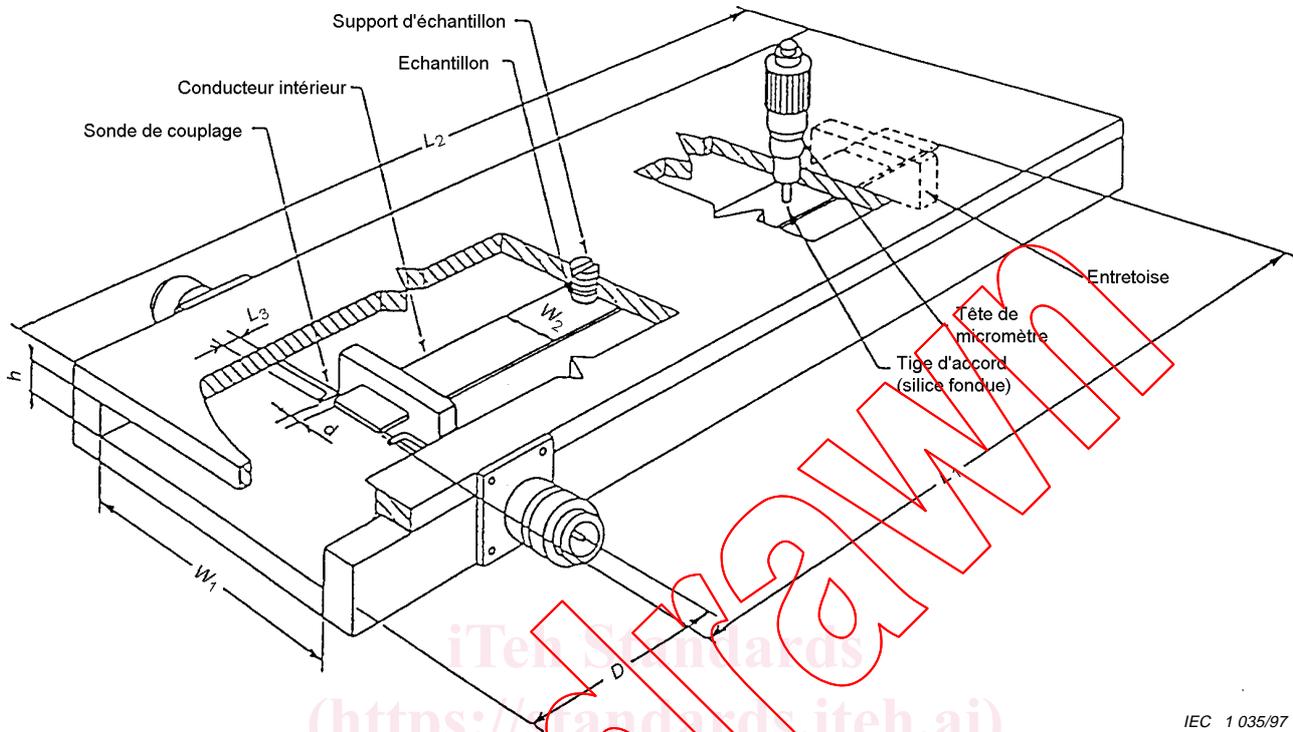
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report of voting indicated in the above table.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai>)
Document Preview

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/510fed71-f9e0-4b30-8910-94e833815e7e/iec-60556-1982-amd1-1997>

WITHDRAWN

Remplacer la figure 12 par la nouvelle figure 12 suivante:



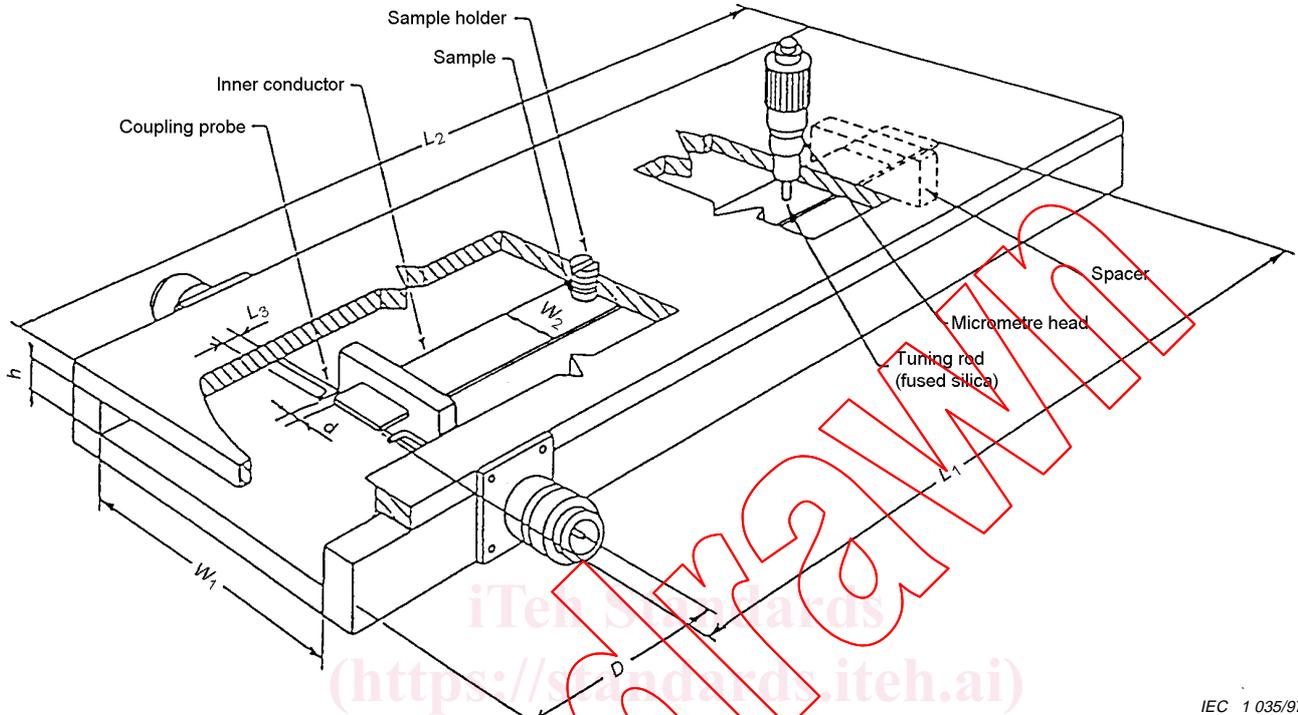
IEC 1 035/97

NOTE – L'entretroise peut être une plaque en PTFE ayant des dimensions typiques de 7 mm par 2 mm par 25 mm, légèrement ajustable en position.

Dimension mm	Fréquence	
	300 MHz	1 000 MHz
d	2,0	2,0
D	39	28
h	7	7
L_1	470	140
L_2	510	180
L_3	21	10
W_1	60	60
W_2	20	20

Figure 12 – Résonateur en ligne triplaque pour la mesure de la largeur de raie de résonance gyromagnétique et du facteur de Landé effectif à basse fréquence

Replace the existing figure 12 by the following new figure 12:



IEC 1035/97

NOTE – The spacer may be a PTFE slab typically measuring 7 mm by 2 mm by 25 mm, slightly adjustable in position.

Dimension mm	Frequency	
	300 MHz	1 000 MHz
d	2,0	2,0
D	39	28
h	7	7
L_1	470	140
L_2	510	180
L_3	21	10
W_1	60	60
W_2	20	20

Figure 12 – Stripline resonator for measurement of gyromagnetic resonance linewidth and effective Landé factor at low frequency

5.4 Echantillons d'essais et cavités

Ajouter, à la page 50, au deuxième alinéa, après «.....conducteur intérieur plat.», la nouvelle phrase suivante:

Les dimensions assurant un facteur de qualité en charge (Q_0) supérieur à 400 sont données pour deux fréquences.

Ajouter, après le dernier alinéa, le nouvel alinéa suivant:

Le procédé préparatif peut introduire des contraintes sur le spécimen affectant la valeur mesurée ΔH . Cet effet peut être réduit au minimum par un procédé de recuit pendant une courte période.

Page 76

8.3.2 Mesure

Remplacer, au deuxième alinéa, la phrase «la fréquence de résonance et au-dessus de 1 MA m^{-1} » par la nouvelle phrase suivante:

la fréquence de résonance de la cavité avec et sans l'échantillon, le Q en charge de la cavité avec l'échantillon et l'échantillon suffisamment saturé magnétiquement, ainsi que les dimensions de la cavité et l'échantillon.

Page 78

8.4 Echantillon d'essai et cavité

Ajouter, après le dernier alinéa, le nouvel alinéa suivant:

Le procédé préparatif peut introduire des contraintes sur le spécimen affectant la valeur mesurée ΔH_{eff} . Cet effet peut être réduit au minimum par un procédé de recuit pendant une courte période.

Page 80

Figure 22

La correction ne concerne que le texte anglais.